

04;10;12

©1995

ПЛАЗМА МИКРОПИНЧЕВОГО РАЗРЯДА КАК ИСТОЧНИК ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

*В.А.Веретенников, А.Е.Гурей, А.Н.Долгов,
О.Г.Семенов, А.А.Тихомиров*

Потребность ядерно-физического эксперимента и технологии стимулируют интерес к методам получения тяжелых многозарядных ионов. Существующие в настоящее время источники ионов обладают определенными недостатками, из которых, в первую очередь, следует отметить недостаточно высокую кратность ионизации и малое количество многозарядных ионов. Разработка более эффективного ионного источника существенно расширяет возможности ускорителей при проведении фундаментальных и прикладных исследований, несомненно также и экономический выигрыш, так как появляется возможность получить ускоренные до релятивистских энергий пучки тяжелых многозарядных ионов на имеющихся ускорителях без их переделки и модернизации.

Плазма микропинча, образующегося в импульсных сильноточных $I > 100$ кА электрических разрядах типа Z-пинч, отличается высокими значениями фиксируемых параметров $T_e \sim 1-10$ кэВ, $\eta_e t \sim 10^{12}-10^{13}$ см $^{-3} \cdot$ с [1] и, вероятно, представляет собой один из перспективных источников многозарядных ионов. В плазме микропинча методами дифракционной рентгеновской спектроскопии зарегистрировано появление ионов зарядности Fe $^{+25}$. Для случая разряда, например, в плазме железа. Микропинчевый разряд может быть реализован в устройстве типа низкоиндуктивной вакуумной искры, которое отличается простотой конструкции и надежностью в эксплуатации.

Нами было предпринято исследование энергетического и зарядового состава сгустков, покидающих плазму низкоиндуктивной вакуумной искры в осевом направлении по току. Применились две методики: сепарация частиц в параллельных магнитном и электрическом полях в анализаторе типа Томсона с регистрацией фотоэмиссионным детектором и времязадерживающая методика с пассивным коллектором (рис. 1, 2). Первая методика обеспечивает калиброванное детектирование каждой компоненты ионной составляющей, вторая — позволяет оценить количество испускаемых ионов и рассмотреть энергетический спектр ионов

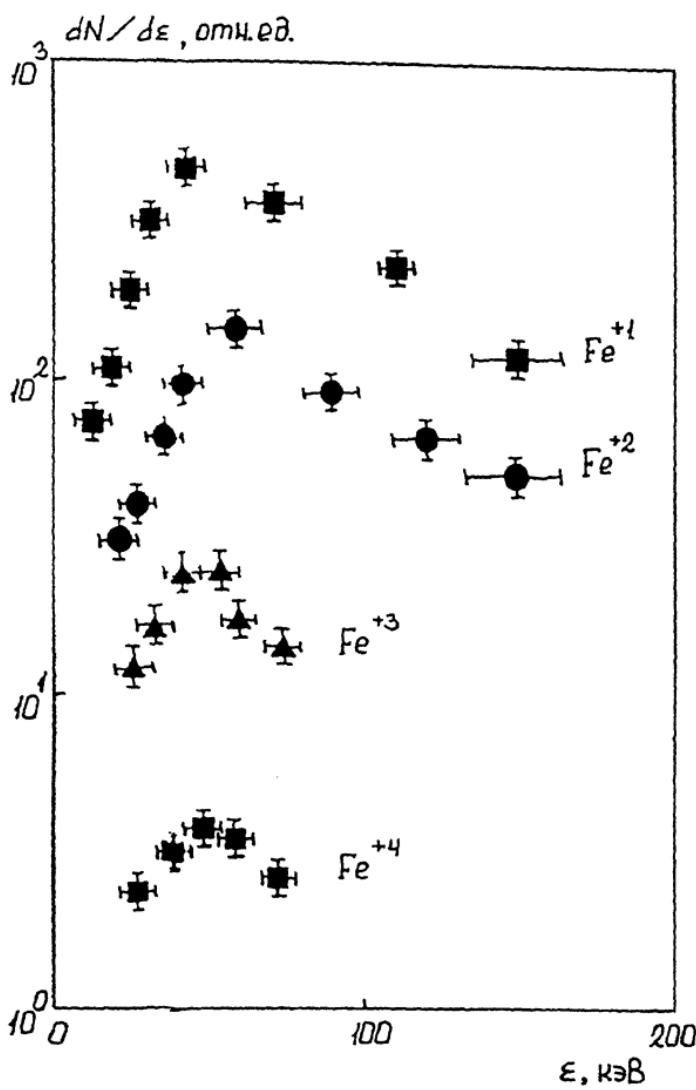


Рис. 1. Энергетические спектры ионов различной кратности, зарегистрированные методом Томсона.

в широком диапазоне. Разряд осуществлялся в вакуумной камере в продуктах эрозии материала электродов. Конический анод и плоский кольцеобразный катод были выполнены из железа. Ток разряда достигал максимального значения $I_\omega \sim 100$ кА за время $T/4 \sim 1$ мкс. Источником тока служит низкоиндуктивная высоковольтная батарея емкостью $C = 5$ мкФ, зарядное напряжение $V_0 = 16$ кВ. Начальный вакуум — не хуже 10^{-4} Тор. Разряд инициируется инжекцией форплазмы от вспомогательного разрядного устройства. Оперативный контроль режима разряда осуществлялся с помощью камеры-обскуры, регистрирующей пространственную структуру излучающей в рентгеновском диапазоне.

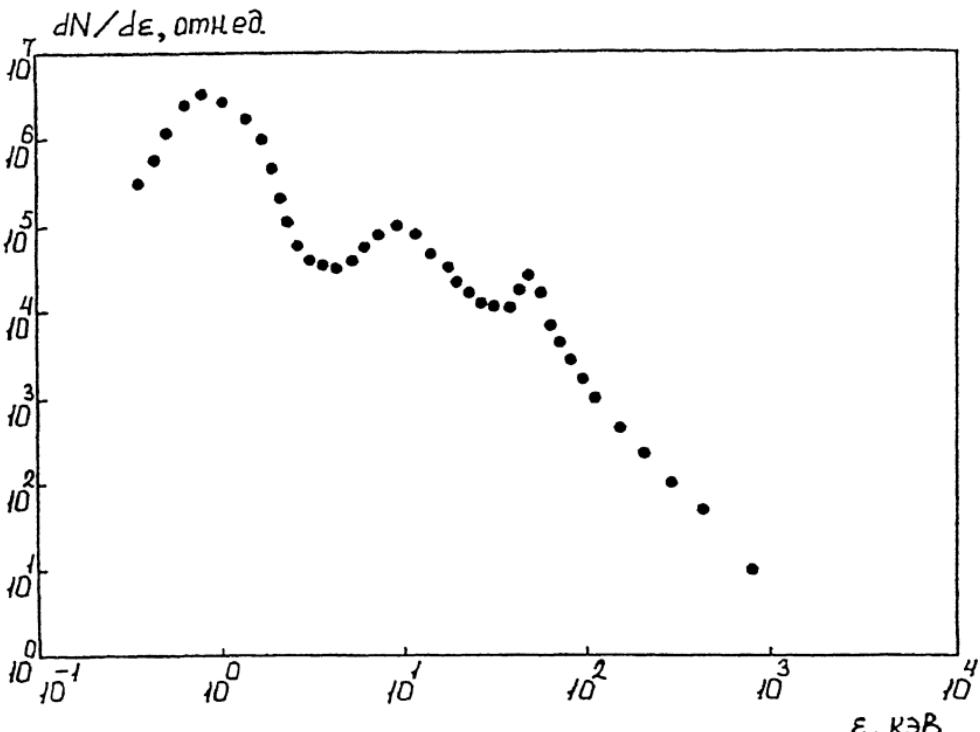


Рис. 2. Энергетический спектр ионов, зарегистрированный с помощью времязадержки методики.

ском диапазоне плазмы, и спинтилляционного дозиметра, регистрирующего дозу испущенного плазмой разряда рентгеновского излучения $I < h\nu < 10$ кэВ. Для выделения ионного пучка из плазмы используется принцип создания бесстолкновительной плазмы с последующим разделением ионной и электронной компонент. Предварительное уменьшение плотности плазмы осуществляется путем свободного расширения в вакуум в пролетном тракте. При использовании времязадержки методики для выделения ионной компоненты на коллектор подавалось отрицательное напряжение смещения. Ввиду отсутствия возможности осуществить прямую калибровку спектрометра Томсона с помощью соответствующего ионного источника был применен "метод математической калибровки" [2]. Используемая методика восстановления энергетического спектра регистрируемых фотоэмulsionационным детектором ионных потоков основывается на полученной автором [3] зависимости плотности покрытия фотоэмulsionии от числа, заряда, массы и энергии ионов.

Результаты регистрации ионных потоков представлены на рис. 1, 2. Уверенно удалось зарегистрировать энергетические спектры ионов железа зарядности от первой до четвертой. Регистрацию ионов более высоких кратностей не-

удалось осуществить в силу ограничений, накладываемых чувствительностью детектора. Ограниченные возможности анализатора Томсона в области низких энергий обусловлены необходимостью использовать диафрагмы, формирующие сколлимированный ионный пучок.

Следует отметить практически полное совпадение энергетических спектров, полученных с помощью анализатора Томсона, без учета абсолютных значений, для ионов разных кратностей. Можно предположить, что механизм генерации ионных потоков в области энергий частиц ~ 50 кэВ связан с формированием потока плазмы, распространяющегося в осевом направлении из перетяжки, т. е. участка плазменного столба разряда, претерпевающего быстрое радиальное сжатие $V \sim (2 - 5) \cdot 10^7$ см/с до микронных размеров.

Вид энергетического спектра, полученного с помощью времязадержкой методики преимущественно для однозарядных ионов, свидетельствует о наличии в ионной эмиссии трех групп ионов, максимумы распределения которых лежат в области энергий частиц $\sim 1, 10$ и 50 кэВ. Появление двух первых групп ионов можно связать с процессами формирования микропинча в результате радиационного сжатия и распада в результате развития аномального сопротивления [4].

Количество эмитируемых за один разряд ионов в приосевой области составило в среднем для ионов с энергиями > 5 кэВ величину $\sim 10^{17}$ ион/ср, причем количество ионов с энергиями ~ 20 кэВ составляет примерно половину от этой величины; для ионов с энергиями < 5 кэВ — $(3-5) \cdot 10^{17}$ ион/ср. Частота следования импульсов 10 Гц.

Список литературы

- [1] Кононов Э.Я., Кошелев К.Н., Сидельников Ю.В. // Физика плазмы, 1985. № 11. С. 927.
- [2] Mozer A. IPF-80-1. Institut fur Plasmaforschung der Universität Stuttgart, 1980. Р. 108.
- [3] Силин П.В. Дис. канд. физ.-мат. наук. М., 1985. С. 176.
- [4] Вихрев В.В., Иванов В.В., Кошелев К.Н. // Физика плазмы. 1982. № 8. С. 1211.

Физический институт
им.П.Н. Лебедева
РАН
Москва

Поступило в Редакцию
12 июля 1995 г.